

Vrsta opreme: Pretražni elektronski mikroskop (SEM)

Proizvođač i model: Tescan Vega III Easyprobe

Godina proizvodnje: 2009.



Tehničke karakteristike:

- volframova žarna nit
- raspon radnog napona ubrzanja 5 – 30 kV
- raspon povećanja 100 – 100 000 puta
- maksimalna nazivna razlučivost 3 nm
- SE i BSE detektor, EDS.

Namjena:

Promatranje suhih uzoraka pod visokim povećanjem i razlučivanje detalja koje je nemoguće postići konvencionalnom optičkom mikroskopijom, uz razmjerno jednostavnu pripremu uzorka. Može se odrediti morfologija uzorka, veličina čestica i pora, a preko rendgenske spektroskopije (EDS) i elementni sastav promatranog uzorka.

Lokacija:

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Zavod za fizikalnu kemiju

Marulićev trg 20/I

Kontakt:

Prof. dr. sc. Jelena Macan

01/4597-236

jmacan@fkit.hr